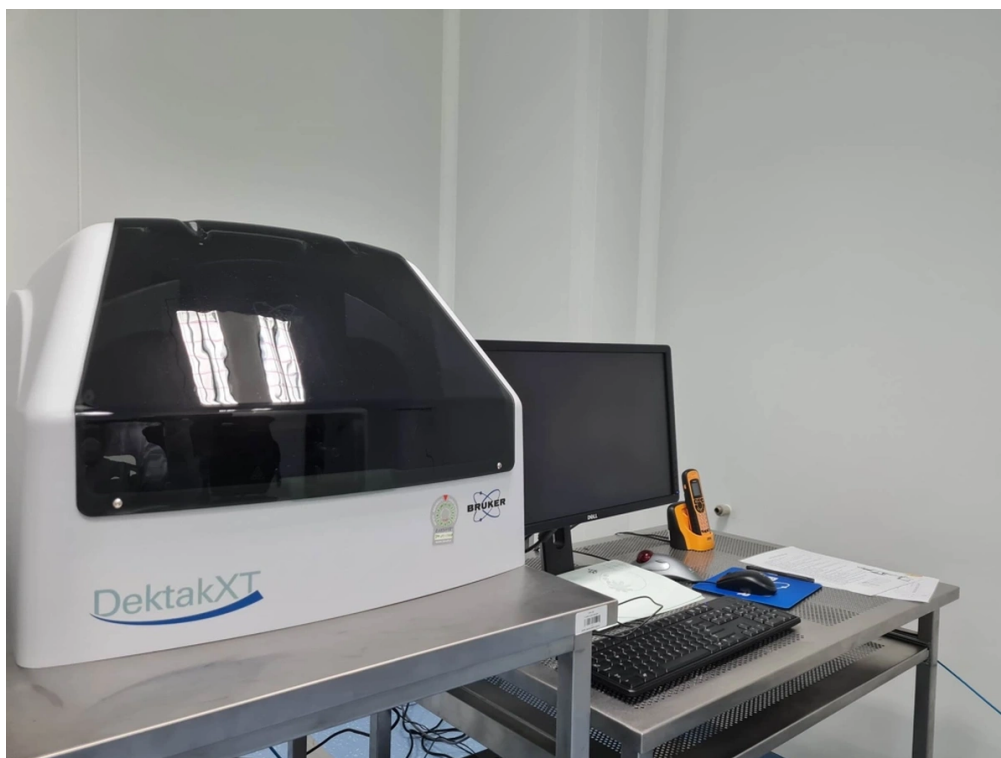


## Profilometr do pomiarów warstw o wymiarach nanometrycznych



### Opis techniczny:

Profilometr igłowy stykowy służący badaniu chropowatości oraz falistości powierzchni z rozdzielczością 1 Å oraz powtarzalnością na poziomie  $4 \text{ \AA}$  (angstrom).

**Nazwa handlowa:** Profilometr Bruker DektakXT

**Więcej szczegółów:** </equipment/profilometr-do-pomiarow-warstw-o-wymiarach-nanomet/>

**Rodzaj dostępu:** Zewnętrzna

**Rodzaj akredytacji / certyfikatu:** Nie dotyczy

**Osoba kontaktowa:** Jurzecka-Szymacha Maria

**Osoba kontaktowa - adres strony www:** <https://skos.agh.edu.pl/osoba/maria-jurzecka-szymacha-7600.html>

**Jednostka odpowiedzialna:** Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii

**Grupa / laboratorium / zespół:** Zakład Efektów Kwantowych w Nanostrukturach

**Data ostatniej aktualizacji:** 10 marca 2025 13:34

**Rok wprowadzenia do użytkowania:** 2013

**Obszary badawcze IDUB:**

(POB 7) Projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną

**Możliwości badawcze:**

Aparatura pozwala na mierzenie grubości nanoszonych przez użytkownika cienkich warstw, tworzenie profili w określonych kierunkach i eksport wartości, wraz z przeliczeniem chropowatości.

**Warunki udostępniania infrastruktury:**

Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z Regulaminu Korzystania z Infrastruktury Badawczej ACMiN. ([https://acmin.agh.edu.pl/home/acmin/5\\_Wspolpraca/Aparatura/Zasady\\_i\\_koszty\\_korzystania\\_z\\_infrastruktury\\_badawczej\\_ACMiN.pdf](https://acmin.agh.edu.pl/home/acmin/5_Wspolpraca/Aparatura/Zasady_i_koszty_korzystania_z_infrastruktury_badawczej_ACMiN.pdf))